

s_2 in Form des Sekundärstrahls S_2 reflektiert. Das gleiche vollzieht sich an sonstigen, in schräger Richtung zu S_1 verlaufenden Strukturebenen des Kristalls. Die Gesamtheit der s -Einstiche auf der photographischen Platte liefert das Muster des Lauediagramms. Die zu jedem Sekundärstrahl gehörige Fläche läßt sich hiernach leicht feststellen in der Erwägung, daß sie, senkrecht zur Einfallsebene $S_1 S_2$ gelegen, den Winkel zwischen Primärstrahl und dem Sekundärstrahl hälftet. Das

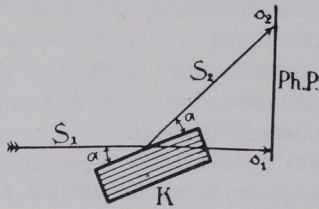


Fig. 546. Reflexion eines Röntgenstrahls.

Winkel zwischen Primärstrahl und dem Sekundärstrahl hälftet. Das Lauediagramm ist danach eine neue oder doch früher in der kristallographischen Praxis nicht verwendete Projektionsart; es stellt eine »Reflexprojektion« dar.

7. Zonenverband im Lauediagramm.

In Fig. 547 bedeutet Punkt K den Kristall, $S_1 S_1$ den Primärstrahl, welcher die photographische Platte PP in s_1 senkrecht durchsticht, und Ks eine zunächst zur Zeichenebene der Fig. 547 senkrecht gedachte Strukturfläche des Kristalls. Der Strahl $S_1 K$ wird von ihr unter dem Spiegelungswinkel α als S_2 reflektiert und auf PP in s_2 aufgefangen. Beim Drehen der reflektierenden Struktur-

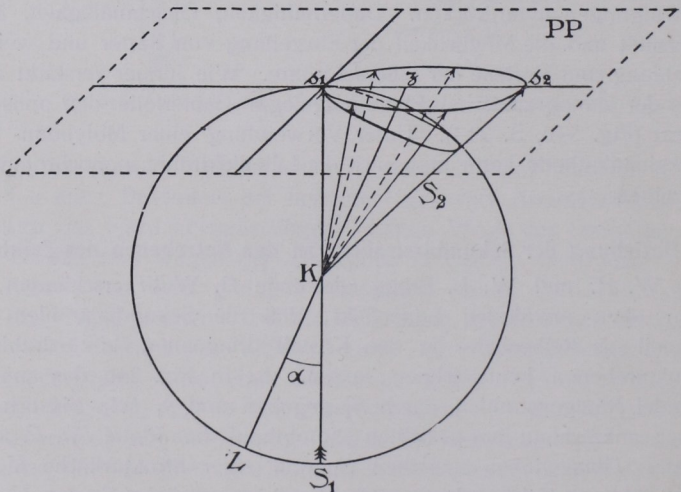


Fig. 547. Zonenverband in der Reflexprojektion.